

Гамма-спектрометрия и металлография твэлов рабочей кассеты ИВВ-2

БЫЧЕНКОВ В. В., ЗЕЛЕНОВ В. И., КАРПЕЧКО С. Г., ПАНКОВ Е. Н., ТИМОХИН А. Н.

УДК 621. 039.665:620.18

После четырехлетней эксплуатации произошла разгерметизация рабочей кассеты исследовательского реактора ИВВ-2, сопровождавшаяся постепенным в течение трех суток увеличением удельной γ -активности теплоносителя первого контура и газовой активности в системе спецификации. Гамма-спектрометрия сухого остатка проб теплоносителя показала наличие осколочных изотопов ^{140}La , ^{132}Te , ^{141}Ce , ^{143}Ce , ^{144}Ce , ^{103}Ru , ^{137}Cs , ^{134}Cs , ^{91}Sr , ^{95}Zr . Высокая удельная активность теплоносителя ($2,7 \cdot 10^{-4}$ Ки/л) при общем объеме воды в баке аппарата 60 м³ свидетельствовала о попадании в теплоноситель продуктов деления с суммарной активностью ~ 20 Ки. Отсутствие урана в воде и нулевая α -активность сухого остатка позволили предположить, что горючее не находилось в непосредственном контакте с теплоносителем. Разгерметизированная кассета была обнаружена с помощью специального канального устройства и удалена в бассейн выдержки. Некоторые характеристики реактора ИВВ-2 и условия эксплуатации разгерметизированной кассеты приведены в таблице, а также в работах [1, 2].

Условия эксплуатации кассеты

Наименование	Характеристика
Тип топливной композиции	Дисперсия уран-алюминиевого сплава в алюминиевой матрице
Материал оболочки	Алюминиевый сплав САВ-1
Тип твэла	Стержневой с оребрением
Обогащение по ^{235}U , %	90
Число твэлов в кассете, шт.	42
Выгорание к моменту разгерметизации (среднее для кассеты, вес. %)	51,9
Интегральный поток тепловых нейтронов, нейтр./см ²	$3,3 \cdot 10^{21}$
Максимальная и средняя температура оболочки в процессе эксплуатации, °C	98; 55
Средний водно-химический режим	pH = 5,5 \div 6,5; жесткость 3 мкг·экв/л; удельное сопротивление $3 \cdot 10^5 \div 2 \cdot 10^6$ Ом ⁻¹ см ⁻¹ ; содержание хлоридов 0,03—0,36 мг/л

После трехлетней выдержки кассета был а разобрана для исследования твэлов методами γ -спектрометрии и оптической металлографии.

Экспериментальная установка для гамма-сканирования твэлов

Установка состоит из заполненного свинцом защитного цилиндрического контейнера, по оси которого расположены канал для перемещения захвата с твэлом относительно коллиматора (рис. 1). Контейнер устанавливается на люке горячей камеры в специальных гнездах, обеспечивающих жесткую ориентировку коллимированного пучка относительно заданной точки чувствительного объема детектора. Размеры центрального канала и захвата подобраны таким образом, чтобы при перемещениях максимальное отклонение оси твэла относительно оси щелевого коллиматора размером $6 \times 0,8$ мм не превышало $\pm 0,3$ мм. Захват снабжен шкалой для регистрации положения твэла по вертикали. Ge(Li)-детектор располагался на расстоянии 710 мм от коллиматора и имел свинцо-

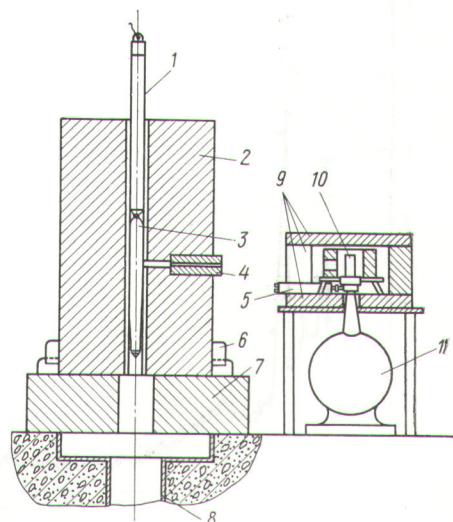


Рис. 1. Экспериментальная установка для γ -сканирования твэлов:

1 — захват для твэла; 2 — контейнер; 3 — твэл; 4 — коллиматор; 5 — предусилитель; 6 — центрирующие детали; 7 — подставка; 8 — люк горячей камеры; 9 — Pb-защита детектора; 10 — детектор; 11 — криостат

вую защиту толщиной до 200 мм для уменьшения фона. Общее разрешение спектрометра составляло 0,8 и 1,0% для линий 661,6 и 1330 кэВ соответственно. Использовался амплитудный анализатор АИ-4096-2-АВ-100 и пересчетный прибор ПП-12. Основное требование к экспериментальной установке — обеспечение высокой точности относительных измерений — достигалось за счет стабильной геометрии установки, высокого отношения пик-комптон для γ -линий спектра, выбором достаточной экспозиции, точной фиксацией положения твэла в контейнере.

Относительное распределение долгоживущих продуктов деления по длине твэлов

В γ -спектре твэлов после трехлетней выдержки идентифицированы линии ^{137}Cs , ^{134}Cs , ^{144}Ce и ^{144}Pr (рис. 2). Получены относительные распределения долгоживущих продуктов деления по длине всех 42 твэлов. Обсчет фотопиков про-

веден методом Ковелла по линиям 661,6 (^{137}Cs); 604,5 (^{134}Cs); 795,8 (^{134}Cs) и 134 кэВ (^{144}Ce).

Статистическую точность результатов измерения определяли экспериментально путем многократного повторения измерений с одинаковой экспозицией для одного и того же участка твэла, причем после каждого измерения твэл смешали и снова возвращали в прежнее положение. Определенная таким образом среднеквадратическая ошибка включает неточность воспроизведения геометрии при перемещениях твэла, статистическую погрешность аппаратуры при регистрации γ -квантов, вероятность самого процесса распада, ошибку в определении площади фотопика. При пятидесятикратном измерении с экспозицией 5,45 мин среднеквадратическая ошибка равна $\pm 0,7\%$ для линии 661,6 кэВ. При экспозиции 21,8 мин статистическая точность увеличивается до $\pm 0,4\%$, при измерении линий 134; 604,5 и 795,8 кэВ она несколько хуже, но ошибка не превышает $\pm 1,5\%$.

У большинства исследованных твэлов (рис. 3 и 4) выявлены особенности в распределениях

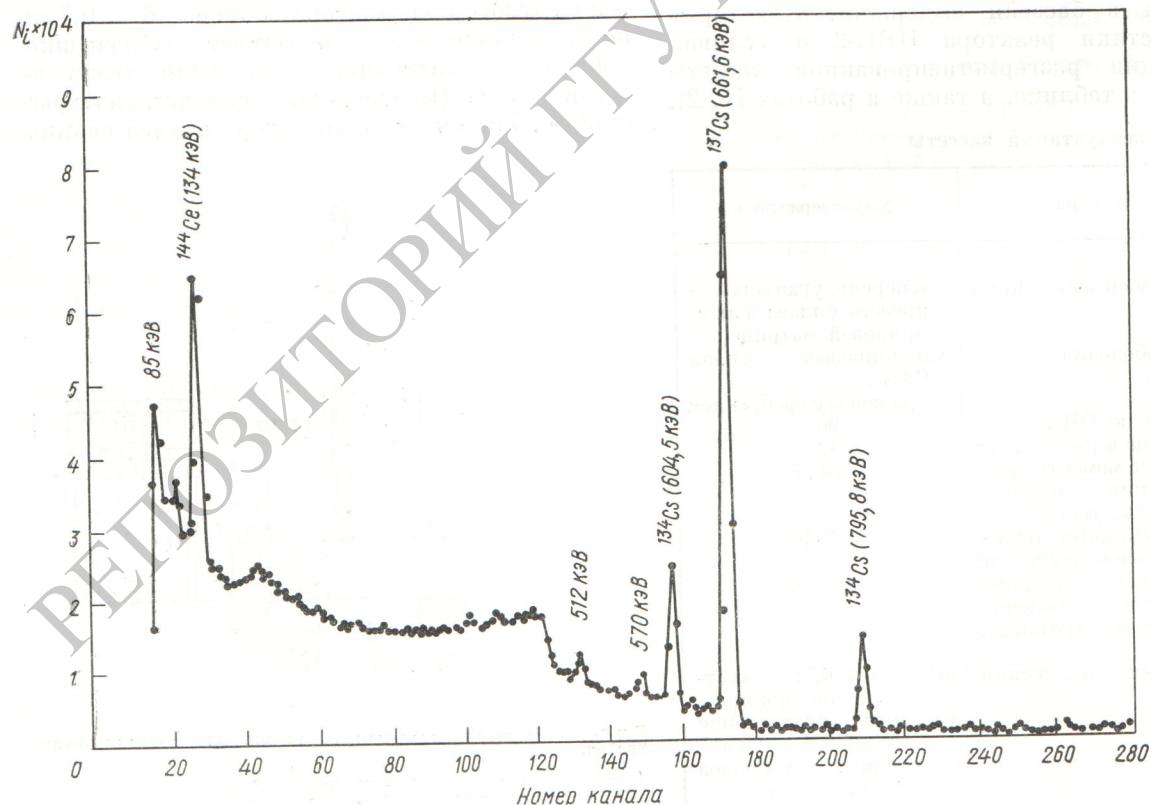


Рис. 2. Спектр продуктов деления в твэлах кассеты

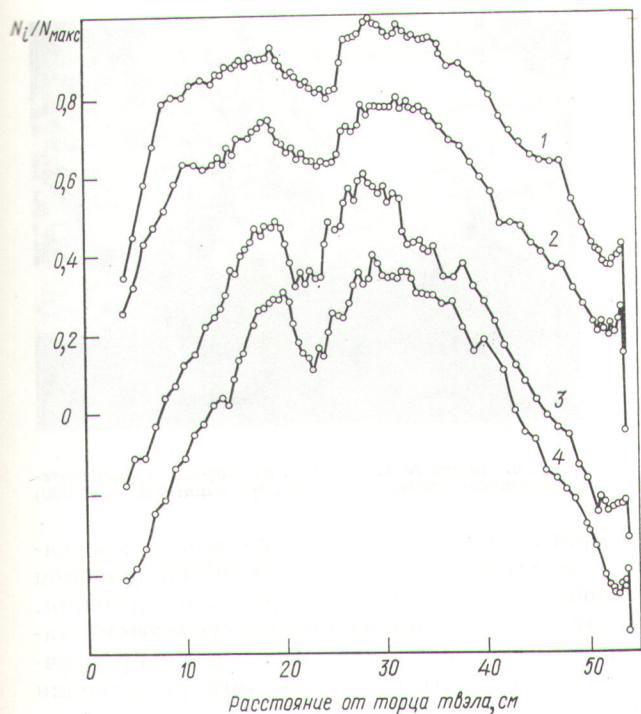


Рис. 3. Относительное распределение долгоживущих продуктов деления по длине твэла № 31. Коллиматор щелевой. Экспозиция 655,4 с:

1 — ^{137}Cs (661,6 кэВ); 2 — ^{144}Ce (134 кэВ); 3 и 4 — ^{134}Cs (604,5 и 795,8 кэВ соответственно)

продуктов деления и обнаружены аномалии, соответствующие центральному участку твэлов, т. е. области максимального выгорания. Число аномалий, их форма и глубина индивидуальны для каждого твэла. Аномалии, как правило, локализованы на участках размером от 0,8 до 3,0 см и достигают 18—20 % относительно максимума кривой распределения. Особенности кривых распределения связаны с технологическими и радиационными факторами. Весовое содержание ^{235}U в сердечнике составляет $35 \pm 1,5\%$, т. е. возможна локальная неравномерность энерговыделения в указанных пределах. Толщина сердечника изменяется монотонно и при рассмотрении локализованных аномалий на кривых распределения не учитывается. Технологические факторы приводят к неравномерности распределения $\pm 4,5\%$ относительно максимума. Появление аномалий также может быть вызвано выходом продуктов деления в месте разгерметизации оболочки твэла. Для выхода осколков деления не обязателен прямой контакт горючего с теплоносителем, достаточно присутствия ослабленных участков из-за межкристаллитной коррозии, технологических де-

фектов или радиационного повреждения матрицы и оболочки. Можно предполагать, что аномалии, превышающие 4,5 %, вызваны выходом продуктов деления в теплоноситель в месте разгерметизации оболочки. Таким образом, метод γ -спектрометрии можно использовать для идентификации места повреждения оболочки твэла. Эффективность метода будет выше для твэлов с меньшей неравномерностью распределения ^{235}U . Интерпретация аномалий распределения продуктов деления в высокотемпературном окисном горючем, облученном до больших выгораний, становится затруднительной в результате влияния трещин и других дефектов структуры. Работы по использованию γ -спектрометрического метода для оценки состояния других типов твэлов будут продолжены.

Металлографическое исследование твэла

Для металлографического исследования был выбран твэл № 25. Резка осуществлялась в го-

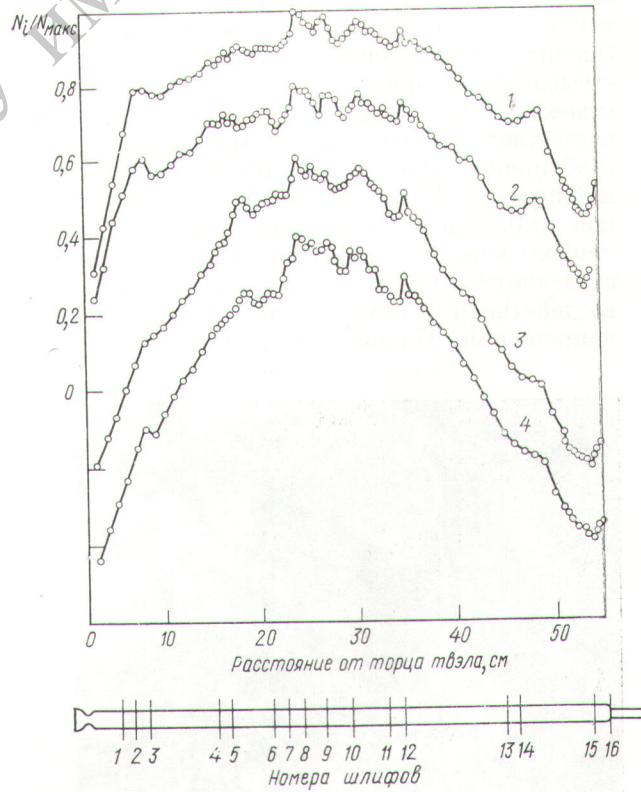


Рис. 4. Схема разделки и относительное распределение продуктов деления по длине твэла № 25. Коллиматор щелевой. Экспозиция 1310,7 с. (Обозначения кривых те же, что на рис. 3.)

рячей камере алмазным кругом с интенсивным охлаждением водой. Относительные распределения продуктов деления и схема разделки приведены на рис. 4. Образцы после шлифовки и полировки обрабатывали раствором Келлера ($1\% \text{HF}$; $1,5\% \text{H}_2\text{SO}_4$; $2,5\% \text{HNO}_3$; $95\% \text{H}_2\text{O}$) в течение 2—10 с и просматривали на микроскопе с увеличением в 100—500 раз. При визуальном осмотре повреждений оболочки не обнаружено. Замечены значительная потеря пластичности и увеличение модуля упругости [3].

Сравнение шлифов центральной и периферийной части твэла показало, что с ростом выгорания увеличиваются пустоты, образующиеся на границах между диспергированными частицами горючего и матрицей в результате бомбардировки осколками деления. Выявлена зависимость степени радиационного повреждения матрицы от размера частиц горючего и объемного содержания делящегося изотопа. Размер частиц горючего, имеющих разную форму, от 0,04 до 0,25 мм. Анализ структуры показал, что при одинаковом выгорании увеличенная пористость матрицы наблюдается в местах скопления более мелких частиц. Эти результаты согласуются с опубликованными данными [4]. Значительная пористость матрицы на участках с высоким выгоранием связана также с присутствием эвтектики (до 11 вес. %). В центральной части твэла вблизи границы между сердечником и оболочкой (рис. 5) обнаружена трещина длиной не менее 40 мм, шириной до 2,5 мм и глубиной до 0,2 мм. Образование трещины в области наибольшего выгорания не случайно. Материал сердечника при эксплуатации находится под воздействием циклических температурных напряжений. По мере роста выгорания темпе-



Рис. 6. Шлиф № 1. Оболочка со стороны теплоносителя. Межкристаллитная коррозия. Эрозионный износ ($\times 500$)

ратурный градиент в твэле увеличивается в связи с образованием пористости и накоплением газообразных и твердых продуктов деления. Механические напряжения усугубляются статическим давлением газовых осколков и различным коэффициентом термического расширения сердечника и оболочки.

Образование пор обнаружено и в частицах интерметаллида в результате накопления и диффузии газообразных и твердых продуктов деления. Следует отметить хорошее состояние диффузионного контакта сердечника с оболочкой.

Металлографический анализ оболочки твэла показал наличие включений интерметаллида Mg_2Si размером от 3 до 20 мкм (рис. 6). Внутренняя поверхность оболочки подвержена бомбардировке ядрами осколков со стороны близлежащих частиц горючего и воздействию химически активных продуктов деления. В результате на глубине до 0,2 мм наблюдается образование пор (см. рис. 5). Со стороны теплоносителя оболочка подвержена межкристаллитной коррозии (см. рис. 6) на глубину 0,2—0,3 мм. Наблюдается эрозионный износ поверхности в турбулизированном потоке теплоносителя, приводящий к нарушению целостности окисной пленки и увеличению скорости коррозии. При металлографическом анализе не были обнаружены сквозные повреждения оболочки, однако глубина аномалий на кривых распределения осколочных элементов и характер выхода этих элементов в теплоноситель во время разгерметизации позволяют предполагать существование ослабленных участков оболочки. Технологические дефекты (овальность сердечника, эксцентричный сдвиг сердечника относительно оси твэла, вмятины в оболочке до 0,5 мм, сколы,



Рис. 5. Шлиф № 9. Радиационное повреждение сердечника и оболочки ($\times 100$)

срезы оребрения) неизбежно приводят к неравномерной толщине оболочки. В местах утонения оболочки могут перекрываться зоны радиационного повреждения со стороны внешней и внутренней поверхностей, что делает возможным выход продуктов деления в теплоноситель.

Таким образом, разработанная установка для γ-сканирования стержневых твэлов реактора ИВВ-2 позволяет выявить особенности распределения долгоживущих продуктов деления и тем самым идентифицировать места повреждения оболочки, подлежащие металлографическому анализу.

В заключение авторы выражают искреннюю признательность А. М. Демидову за обсуждение результатов работы и высказанные ценные замечания, а также В. П. Криворотовой,

В. Н. Новицкихину и З. Б. Слепухиной за помощь при металлографическом анализе и обработке результатов.

Поступила в Редакцию 15/VII 1974 г.
В окончательной редакции 9/I 1975 г.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Гощицкий Б. Н. и др. «Атомная энергия», 1968, т. 25, вып. 1, с. 21.
- Веселкин А. П. и др. В сб.: Вопросы физики защиты реакторов. Вып. 5. М., Атомиздат, 1972, с. 251.
- Кузнецова А. П., Шаров Б. В. «Атомная энергия», 1966, т. 21, вып. 1, с. 58.
- Вебер К. Е., Гирш Г. Г. В кн.: Металлургия ядерной энергетики и действие облучения на материалы. М., Металлургиздат, 1956, с. 298.

Рецензии

Современная ядерная электроника. В двух томах. Т. 1. Измерительные системы и устройства. Авт.: Крашенинников И. С., Курочкин С. С., Матвеев А. В. и др. М., Атомиздат, 1974, 20 л., 2 р. 20 к.

Современная ядерная электроника, призванная решать задачи ядерной физики, все больше выступает не в качестве подсобной или второстепенной дисциплины, а как самостоятельный раздел общей электроники.

Рецензируемая книга отличается от многих предшествующих изданий более строгим научным подходом к раскрытию тем и изложению содержания. Это не учебник, однако включенный в книгу материал может быть весьма полезен физикам, инженерам, преподавателям, работающим в этой области или применяющим электронику для научных и технических целей.

Первый том содержит две главы. В первой обобщен и переработан фундаментальный материал по теоретическому анализу факторов, определяющих физическую природу и характер регистрируемых потоков данных, получаемых от детекторов ионизирующего излучения. Этот материал имеет важное значение, позволяя строго научно обосновать предельные или точностные характеристики регистрируемых данных, которые в процессе измерения претерпевают влияние детектирующих, усиливющих, формирующих, кодирующих и прочих устройств. В то же время сами потоки на входе могут характеризоваться сложными статистическими закономерностями по многим параметрам (например, амплитудному, временному распределению и пр.), а реакция перечисленных устройств, помимо специфичных передаточных функций, может усложняться многими дополнительными факторами, такими, как шумовые флуктуации, статистический разброс значения параметров и т. п. Заслугой авторов является систематизация, обобщение и научное обоснование этих сведений, распространенных в многочисленной литературе.

К некоторым недостаткам этой главы следует отнести отсутствие более полных сведений по управляемым и оптимальным фильтрам, позволяющим получить более высокое отношение сигнал-шум. Кроме того желательно в последующих изданиях дать большее число

разных примеров и численно решенных задач, иллюстрирующих теоретические выводы.

Вторая глава посвящена разбору элементов и узлов современных электронных приборов ядерной физики, характеризующихся широким применением микроэлектроники, повышенными параметрами по сравнению с ядерной электроникой второго поколения, большим числом кодируемых данных, а также включением в свой состав технических средств прямой связи с ЭВМ.

Следует отметить, что быстрое развитие микроэлектронной базы резко изменило структуру приборов ядерной электроники и потребовало новых подходов при их создании. Это нашло отражение в книге, и в настоящее время нет более полного изложения подобного материала. В книге приведены особенности работы схем, их структуры, рассмотрена схемотехника и методы, позволяющие реализовать заданные параметры и точности работы узлов усиления формирования, амплитудного и временного кодирования, аналоговых операций и других процессов обработки сигналов, характерных для ядерной электроники. Эти сведения весьма полезны разработчикам электронной аппаратуры, в том числе неядерного профиля, так как они обобщают рассредоточенные сведения, содержат анализ причин и факторов, от которых зависят получаемые характеристики.

К недостаткам этого раздела или общей компоновки материала следует отнести «резкий» переход от строгого изложения теоретических вопросов первой главы к разбору конкретных аппаратурных элементов второй главы. Следовало бы ввести дополнительный параграф, показывающий аппаратное построение систем и узлов, как следствие теоретических выводов. Кроме того, во второй главе есть некоторое дублирование в описании шумовых процессов в усилителях.

В настоящее время невозможно в ограниченном объеме книги передать все разнообразие в построении отдельных приборов, важно дать основные мало стареющие принципы и методы, с чем авторы книги успешно справились.

Рецензируемая книга — весьма полезна для широкого круга читателей. Она вносит существенный вклад в развитие отечественной науки и приборостроения.

ШТАРНИХ И. В.